

日本学術振興会計測分析プラットフォーム第193委員会 第3回公開講演会
イノベーション創出に向けた計測分析プラットフォームの構築
～サイバー空間を活用した複合計測分析システム開発の現状～

つくば会場及び
オンラインで開催

日時：2020年12月4日(金曜日)
場所：つくば国際会議場中会議室202及びウエブ

参加費無料

ビッグデータ・AI活用の時代を迎えて、計測分析データの多面的な活用に向けたプラットフォームの構築が大きな課題となっています。日本学術振興会第193委員会の第3回公開講演会では、WGの活動報告に加えて、計測分析装置の共通データフォーマットの構築やビッグデータ解析に係わるNEDOプロジェクト（2020年3月終了）の成果報告を行います。積極的なご参加をお待ちしています。

主催：日本学術振興会計測分析プラットフォーム第193委員会

後援：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、（一社）日本分析機器工業会、（公社）新化学技術推進協会（JACI）、（公社）日本分析化学会、（一社）表面分析研究会

講演内容（講演者敬称略）

第1部 学振193委員会における計測分析プラットフォーム構築活動報告

13:00-13:15 共通基盤WGの活動概要

重藤 知夫（共通基盤EWG主査、産業技術総合研究所）

13:15-13:30 計測インフォマティクスWGの活動概要

永富 隆清（計測インフォマティクスWG主査、旭化成）

第2部 「省エネ製品開発の加速化に向けた複合計測分析システム研究開発」プロジェクトの報告

13:30-13:40 プロジェクトの全体概要

長島 敏夫（PM/新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO））

13:40-14:00 CPS型複合計測分析用のデータプラットフォーム構築技術の開発

大橋 秀実（日本電子）

14:00-14:35 CPS型複合計測分析用の試料保持・精密位置決め技術の開発

アラインメントマーカーを用いた精密位置決め技術と共通試料ホルダー（20分）

保田 芳輝（堀場製作所）

ナノ粒子マーカーを用いた精密位置決め技術と共通試料ホルダー（15分）

安永 卓生（九州工業大学）

14:35-14:50（休憩）

14:50-15:10 試料前処理と測定結果の信頼性向上技術

藤本 俊幸、加藤晴久（産業技術総合研究所）

15:10-16:30 AIを活用したビッグデータ解析のモデル実証による評価技術の開発

タイヤ材料・磁石材料解析に向けた構造化ライブラリーの開発（20分）

山下誠司、北 英紀（名古屋大学）

タイヤ材料・磁石材料解析における特徴量抽出と解析アルゴリズムの開発（20分）

赤穂 昭太郎/丸山 豊（産業技術総合研究所）

磁石材料開発に向けた粒界構造解析用統合ビューアの開発とモデル実証（20分）

柳内 克昭（TDK）

タイヤ材料開発に向けた複合階層構造解析用統合ビューアの開発とモデル実証（20分）

山田 宏明（住友ゴム工業）

総括質疑 16:30-17:00

（司会）一村 信吾（PL/早稲田大学）

申し込み：<https://forms.gle/WkPmqJBxg6B6HNbE7>（申込み締切：2020年12月1日）

※ 申し込みに関する問合せは、早稲田大学 研究戦略部門 一村 (s.ichimura@aoni.waseda.jp) まで